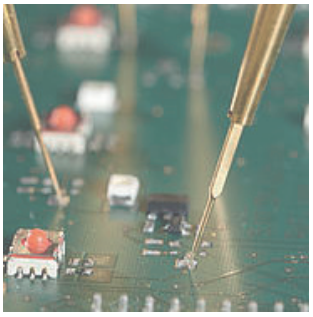
FLYING PROBES

- ZUM ADAPTERLOSEN TESTEN VON LEITERPLATTEN
- FÜR LANGLEBIGE ANWENDUNGEN
- HOHE WIEDERHOLGENAUIGKEIT



1099708 - Flyer Flying Probes, Version 1

FEINMETALL
Contact Technologies

FEINMETALL
Contact Technologies

FL177

NEU

Kontaktierung von bestückten und unbestückten Leiterplatten

Raster (mm/mil)	4,50 / 177
Strom	8,0 A
R typisch	30 mOhm
Temperatur	-45°C...+100°C

Federkräfte (cN ±20%)

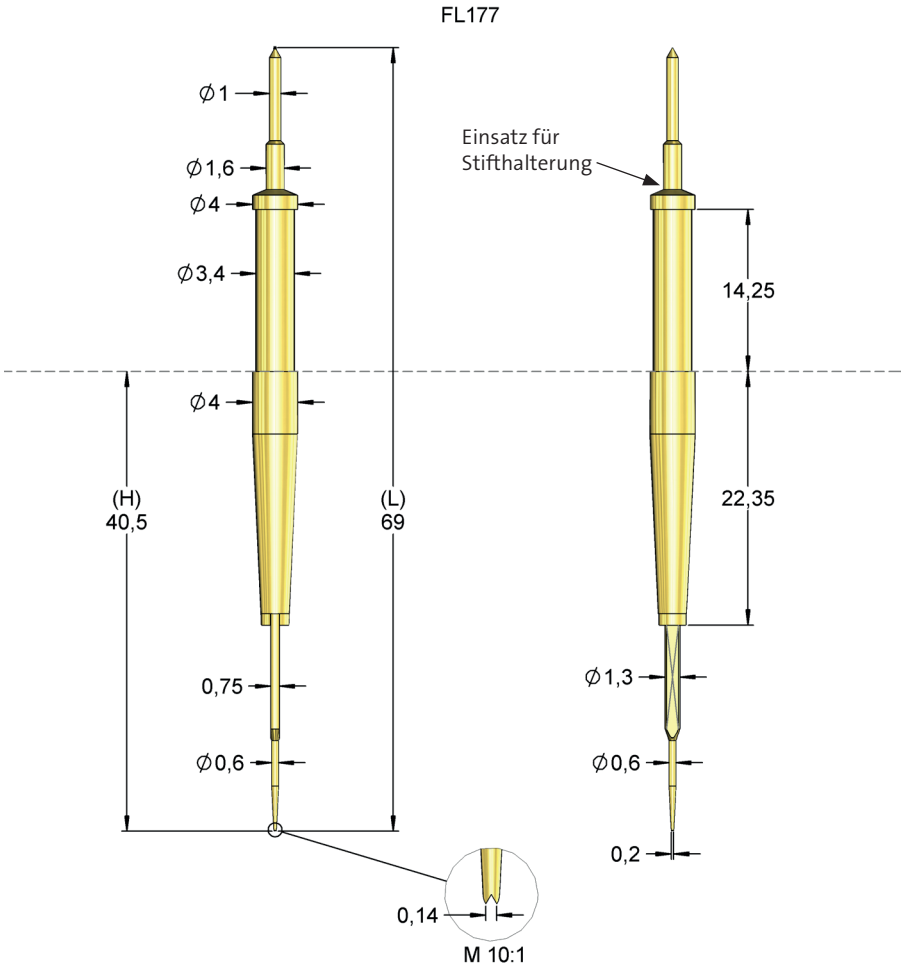
Version	Vorspannung	Nennkraft
Standard	24	40
Standard	60	100

Federwege (mm)

Version	Nenn-Hub	Max. Hub
Standard	2,0	10,0

Materialien und Oberflächen

Kolben	Stahl, Langzeitgold
Mantel	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, versilbert



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Kopfform	KF-#	Material	Ø in mm	Beschichtung
1095118	FL11829S020L100E38C111-2		29	S	0,20	L
1092272	FL17703S030L100A211		03	S	0,30	L
1092266	FL17710S050L100A741		10	S	0,50	L
1092274	FL17729S020L040A112		29	S	0,20	L
1092271	FL17729S020L100A111		29	S	0,20	L
1095396	FL17729S020L100B111-2		29	S	0,20	L
1092269	FL17730S060L100A611		30	S	0,60	L
1092273	FL17730S070L100A621		30	S	0,70	L

Bei der Herstellung elektronischer Leiterplatten werden FM Flying Probe Nadeln zum Testen von bestückten, als auch unbestückten Leiterplatten verwendet.
Durch den technischen Aufbau ist die Nadel hochpräzise und kontaktiert Bauteilpins und Pads auf Baugruppen und Leiterplatten. Mit dem niedrigen Innenwiderstand der FM-Flying Probe Nadeln ist ein stabiler, elektrischer Test sehr gut durchführbar.

Die **Serie FL177** bietet besonders für diesen sensiblen Anwendungsbereich einige Vorteile:

- Hohe Lebensdauer bis > 2mio. Lastwechsel
- Verdrehsicherung erlaubt eine hohe Wiederholgenauigkeit der Kontaktierung
- Optimierte Kopfformen auf kleinstem Raster
- Robuste und verschleißarme Kontaktköpfe und Kolben
- Geringe und konstante Widerstände